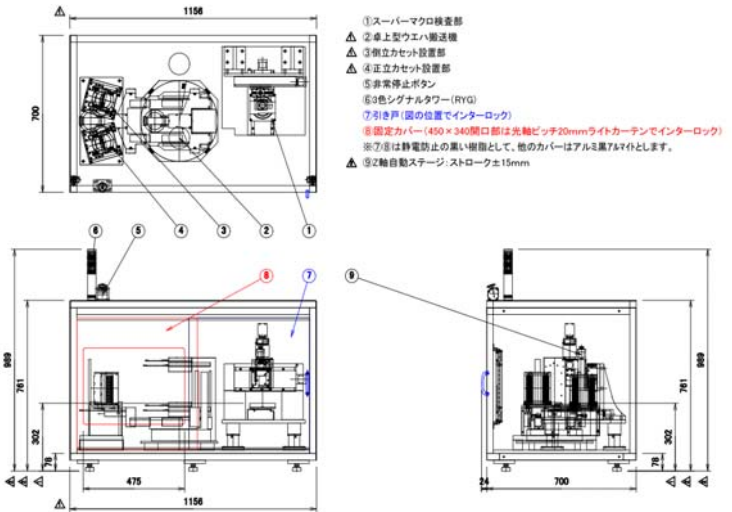
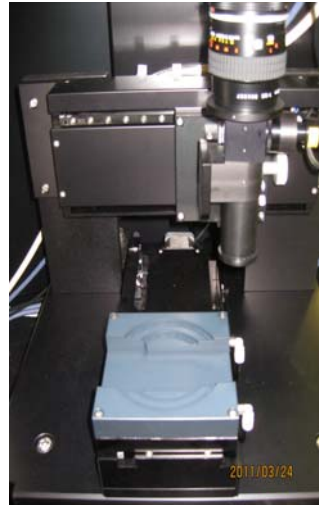


## 全自動S I C検査装置



### 概要

**全自動全数全面測定**が可能なスーパーマクロ検査装置になります。  
 測定ワークを、カセットに装着しておけば、サンプル全面を全自動で測定いたします。  
 今までの装置は、大変高価で、装置も大きく、取り扱いが大変でしたが、小型低価格を、実現いたしました。  
 S I Cや、G a nの内部欠陥を超高速で検査でき、(1視野1秒以下) サファイア基板の傷検査も可能です。  
 測定サンプルサイズも標準でφ300mm迄対応ですが、PDFなどの大型基板にも、対応いたします。  
 カセット数も、ご要望に応じ表面、裏面、検査後の3カセット対応でクリーンルーム内での設置も可能です。  
 サンプル面に触れない、エッジランプ式も選べます。

### 装置仕様

スーパーマクロ部	
形式	SM-30
視野サイズ	最大φ30mm
カメラ	130万画素CMOS
レンズ	55mmマイクロニッコール
照明	高輝度LED (PC調光)
フォーカス	輝度追従型 (自動)
使用OS	Windows XP、または7
検査時間	1視野1秒以下

搬送ロボット部 (一例)	
被搬送物	最大φ150mmウエハ
動作範囲	アームストローク (R軸) 240mm
旋回角度 (θ軸)	340度
上下ストローク (Z軸)	200mm
搬送速度	R軸 240mm/0.8sec θ軸 180度/0.8sec Z軸 200mm/0.8sec
ステージ部	自動X軸、Y軸、Z軸

### アプリケーション

- S I Cや、G a nの内部のマイクロパイブ
- サファイア基板やシリコン基板の表面検査
- 基板の反りや凹凸、応力歪み
- 熱スリップの検査
- マイクロクラック
- 内部の脈理や、気泡検査
- B G研磨痕の検査や評価
- 各種のウエハやF P Dの内部や表面検査

### 測定例

